

第67回応用物理学会春季学術講演会シンポジウム

T-25 : 先端イオン顕微鏡技術の近年の進捗 ナノ材料・デバイスへの展開

Recent progress in Advanced Ion Microscopy: Application to
nano materials and devices

2020年3月13日(金) 13:30 ~ 18:00 @ 上智大学

イオン顕微鏡技術への認識を深め、今後の材料、デバイスの研究開発での有効活用を促し、イオン顕微鏡技術、および材料・デバイス技術の研究開発を加速することを目的として、近年のガスおよび金属イオン顕微鏡など先端イオン顕微鏡技術を用いたいくつかの研究成果を広く議論します。英語での発表ですが、質疑は日本語大歓迎です。

世話人: 小川真一(産総研)、水田 博(北陸先端大)
米谷玲皇(東大)、中払 周(NIMS)

講演の一部

1. Planar-type Si thermoelectric generators using nanopatterning
Masahiro Nomura (The Univ. of Tokyo)
2. Analytical capabilities on HIM using SIMS: applications, current developments and prospects
Olivier De Castro (LIST)
3. Fabrication of High-Q nanofiber Bragg Cavity Using a Helium Ion Microscope
Hideaki Takashima (Kyoto Univ.)
4. High Tc super conductor Josephson Junction by helium ion microscopy
Shane Cybart (UC Riverside)
5. Recent progress in Light Ion Microscope Technology
Vignesh Viswanathan (Zeiss)
6. Technology and applications of a plasma ion source with user-selectable ion species
Sean M. Kellogg (Thermo Fisher Scientific)

